

**S1ZB□**

**800V 0.8A**

### 特長

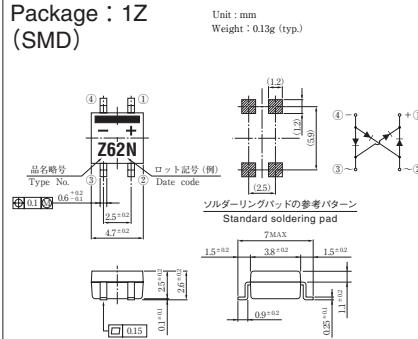
- 小型DIPパッケージ
- 耐久性に優れ高信頼性
- 自動実装対応

### Feature

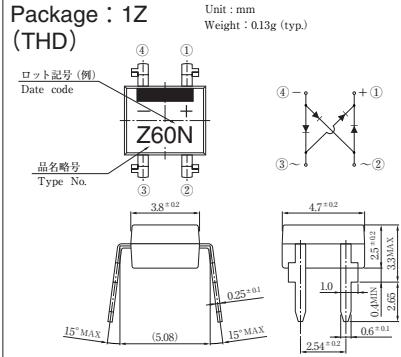
- Small-DIP
- High-Reliability
- for Auto-Mount

### ■外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS

Package : 1Z  
(SMD)



Package : 1Z  
(THD)



(製品上の表示については、捺印仕様をご確認ください)

### ■定格表 RATINGS

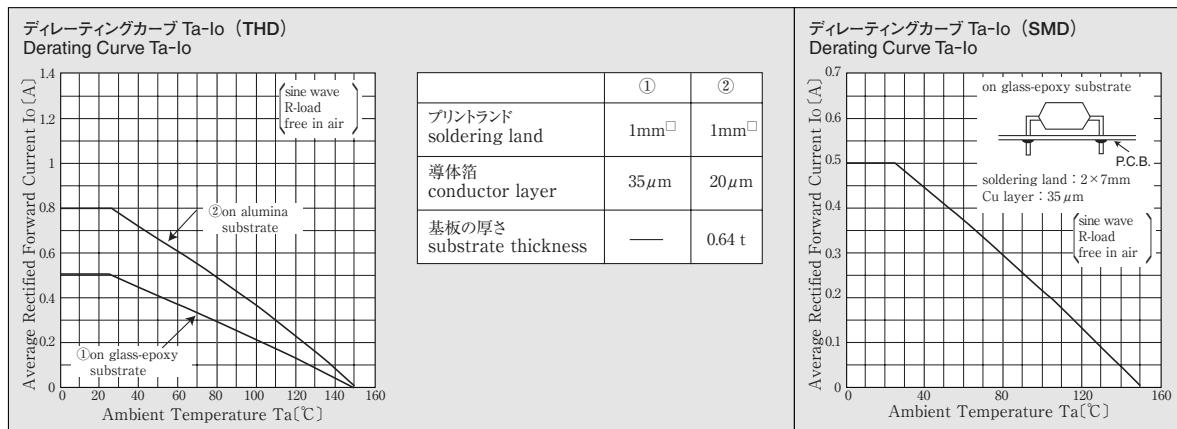
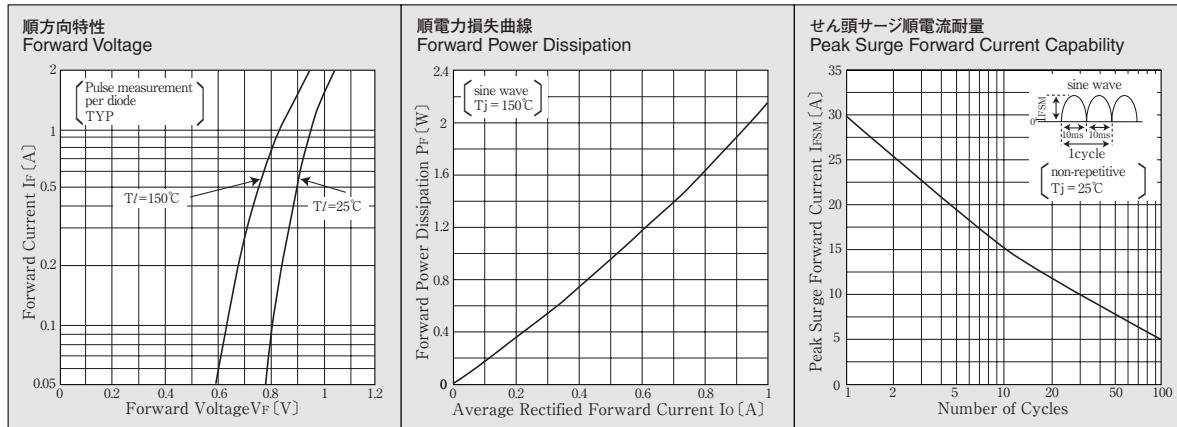
#### ●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_{l}=25^{\circ}\text{C}$ / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	S1ZB□			単位 Unit
				20	60	80	
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-40~150			°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	T <sub>j</sub>			150			°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V <sub>RM</sub>			200	600	800	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I <sub>O</sub>	50Hz 正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	アルミナ基板実装, T <sub>a</sub> =25°C On alumina substrate, T <sub>a</sub> =25°C	0.8			A
			プリント基板実装, T <sub>a</sub> =25°C On glass-epoxy substrate, T <sub>a</sub> =25°C	0.5			
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I <sub>FSM</sub>	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, T <sub>j</sub> =25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, T <sub>j</sub> =25°C		30			A
電流二乗時間積 Current Squared Time	I <sub>t</sub>	1ms ≤ t < 10ms T <sub>j</sub> =25°C		4.5			A <sup>2</sup> s

#### ●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_{l}=25^{\circ}\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> =0.4A, パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, per diode		MAX 1.05	V
逆電流 Reverse Current	I <sub>R</sub>	V <sub>R</sub> =V <sub>RM</sub> , パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, per diode		MAX 10	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	θ <sub>jl</sub>	接合部・リード間 Junction to Lead		MAX 20	°C/W
	θ <sub>ja</sub>	接合部・周囲間 Junction to Ambient	アルミナ基板実装 On alumina substrate	MAX 76	
			プリント基板実装 On glass-epoxy substrate	MAX 134	

## ■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- Sine wave は 50Hz で測定しています。
- 50Hz sine wave is used for measurements.
- 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。Typical は統計的な実力を表しています。
- Semiconductor products generally have characteristic variation. Typical is a statistical average of the device's ability.